



Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen

6. bis 8. März 2016, Siegen

Call for Papers

Programmkomitee

J. Alt
Intel Mobile Communications GmbH

B. Becker
Universität Freiburg

R. Drechsler
Universität Bremen und DFKI

S. Eggersgluß
Universität Bremen und DFKI

P. Engelke
Infineon Technologies AG

G. Fey
Universität Bremen

M. Fischer
Advantest GmbH

A.-P. Fonseca-Müller
Robert Bosch GmbH

M. Gössel
Universität Potsdam

S. Hellebrand
Universität Paderborn

K. Hofmann
Technische Universität Darmstadt

F. Hopsch
Fraunhofer IIS EAS Dresden

W. Hoppe
Rheinmetall Technical Publications GmbH

M. Kochte
Universität Stuttgart

R. Krämer
IHP Frankfurt/Oder

I. Polian
Universität Passau

F. Pöhl
Intel Mobile Communications GmbH

S. Sattler
Universität Erlangen-Nürnberg

M. Sauer
Universität Freiburg

M. Schillinsky
NXP Semiconductors Germany GmbH

J. Schlöffel
Mentor Graphics Development (Deutschland) GmbH

M. Schölzel
Universität Potsdam und IHP

H. Schmidt
IBM Deutschland Entwicklung GmbH

V. Schöber
Leibnitz-Universität Hannover

M. Tahoori
Karlsruhe Institut of Technology

D. Tille
Infineon Technologies AG

H. T. Vierhaus
BTU Cottbus

M. Wahl
Universität Siegen

R. Wagner
Robert Bosch GmbH

H.-J. Wunderlich
Universität Stuttgart

Der Workshop „Testmethoden und Zuverlässigkeit von Schaltungen und Systemen“ ist das bedeutendste deutschsprachige Forum, um Trends, Ergebnisse und aktuelle Probleme auf dem Gebiet des Tests, der Diagnose und der Zuverlässigkeit digitaler, analoger, Mixed-Signal- und HF-Schaltungen zu diskutieren. Der Austausch von Ideen ist ein wichtiges Anliegen des Workshops. Erwünscht sind sowohl Beiträge aus der industriellen Praxis als auch von Forschungseinrichtungen. Wir begrüßen stark praxisbezogene Erfahrungsberichte und Ergebnisse ebenso wie Beiträge zu theoretischen Themen.

Beiträge zu folgenden und weiteren Themen werden erbeten

- Defekt- und Fehlermodellierung
- Testerzeugung und Fehlersimulation
- Testgerechter Entwurf
- Selbsttest für Module und Systeme
- Test von HF-Schaltungen
- Systemtest und -zuverlässigkeit, funktionale Sicherheit
- Diagnose von Ausfallursachen
- Selbstreparatur und Selbstheilung
- Fehlertoleranz und Online-Test
- Robuste und strahlenresistente Systeme
- Test mechatronischer Systeme
- Automatisches Test-Equipment und Testmodellierung
- Testkosten und Qualität

Der Workshop findet im Haus der Siegerländer Wirtschaft in Siegen statt und wird vom Lehrstuhl für Mikrosystementwurf an der Naturwissenschaftlich-Technischen Fakultät der Universität Siegen durchgeführt. Interessenten werden gebeten, die Zusammenfassung ihres Beitrags im Umfang von maximal zwei Seiten über die Workshop-Homepage einzureichen. Der Beitrag sollte den Zweck der Arbeit, den Neuigkeitsgehalt und Aspekte der Anwendung beschreiben. Angenommene Beiträge werden auf Wunsch in die Workshop-Handouts aufgenommen.

Um einen freien Austausch von Ideen und Informationen zu erleichtern, sind während des Workshops Video- und Audioaufzeichnungen nicht gestattet. Die Sprache des Workshops ist deutsch, Beiträge oder Vorträge in englischer Sprache sind jedoch willkommen.

Workshop-Homepage

<http://www.tuz-workshop.de>

Einreichung der Beiträge

max. 2 Seiten bis spätestens **31. Oktober 2015** über die Workshop-Homepage

Veranstalter

GI FA 3.5 / ITG FA 8.2 / GMM FA 6.5

RSS Kooperationsgemeinschaft Rechnergestützter Schaltungs- und Systementwurf, Universität Siegen

Tagungsleitung

Michael Wahl
Universität Siegen, Hölderlinstr. 3
57068 Siegen
Tel.: +49-271-740-2474 , Fax -2473
e-mail: michael.wahl@uni-siegen.de

Programmkomitee-Vorsitzender

Ilia Polian
Universität Passau, Innstr. 43
94032 Passau
Tel.: +49-851-509-3041, Fax: -3042
e-mail: ilia.polian@uni-passau.de